



Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/803,961	NAGASHII ET AL.	
Examiner	Art Unit	-
Lee Lum	3611	

	SEAR	CHED		
Class	Subclass	Date	Examiner	
RESE	ARCI	11/30/	05 ff	

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
	,		
			l

SEARCH NO (INCLUDING SEARCH	TES STRATEGY	<u>()</u>
	DATE	EXMR
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		-